文章编号: 1004-0609(2008)01-0103-05

放电等离子烧结制备 Zn-Cu-Sb-Bi 合金的热电性能

毛立鼎^{1,2},钱 欣¹,崔教林²,陈东勇³

(1. 浙江工业大学 化学工程与材料学院,杭州 310014;
 2. 宁波工程学院 机械工程学院,宁波 315016;
 3. 中国矿业大学 材料科学与工程学院,徐州 221008)

摘 要: 采用真空熔炼/放电等离子烧结(SPS)方法制备 P 型 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x(x=0~0.8)材料,研究该合金的组织结构和热电性能。结果表明,x < 0.2 时,Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x材料的 Seebeck 系数随 x 值增大而增大,当x=0.2 时达到最大值;而当x > 0.2 后,Seebeck 系数又随 x 值增大而下降。在x=0.2 和 487 K 的条件下,Seebeck 系数达到最大值,为 249.2 μ V/K。合金的电导率随 Cu 和 Bi 含量增加而增大。借助 Zn_{4-x}Cu_xSb₃的热扩散系数,计算得到材料的热导率随 x 值增大而增大;在 574 K,x=0.4 时,Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x合金的最大热电优值(*ZT*)为 0.53,比同温度下 β -Zn₄Sb₃合金的 *ZT* 值大 0.07。

Thermoelectric properties of Zn-Cu-Sb-Bi alloys prepared by spark plasma sintering

MAO Li-ding¹, QIAN Xin¹, CUI Jiao-lin², CHEN Dong-yong³

(1. College of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology,

Hangzhou 310014, China;

2. School of Mechanical Engineering, Ningbo University of Technology, Ningbo 315016, China;

3. School of Materials Science and Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221008, China)

Abstract: P-type $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ (x=0-0.8) alloys were prepared through vacuum melting and spark plasma sintering, and their structures were characterized. The results show that the Seebeck coefficient (α) increases with molar fraction (x) up to x=0.2 and then decreases, the electrical conductivity (σ) increases with increasing molar fraction x value. Considering the same fabrication technology of $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ and $Zn_{4-x}Cu_xSb_3$ with the same x, the measured thermal diffusivities of $Zn_{4-x}Cu_xSb_3$ were used to calculate the thermal conductivities of $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$. A relative enhancement of ZT is attained for $Zn_{3.6}Cu_{0.4}Sb_{3.6}Bi_{0.4}$, whose ZT is 0.53 at 574 K, about 0.07 higher than that of Zn_4Sb_3 at the same temperature.

Key words: Zn-Cu-Sb-Bi alloys; co-doping; thermoelectric properties; spark plasma sintering (SPS)

β-Zn₄Sb₃ 是 一 种 具 有 较 高 热 电 优 值 的 中 温 (400~800 K)热电材料,在 263~765 K 的温度区间内稳 定存在^[1-2]。β-Zn₄Sb₃ 是 Zn₄Sb₃ 3 种晶型(α, β 和 γ)中的 一种,晶体结构非常特殊,每个晶胞中 12 个 Zn 原子 和 4 个 Sb 原子具有确定的位置,另外 6 个位置上 Zn 原子和 Sb 原子随机出现,导致晶体内部原子同时存 在有序和无序两种排列方式^[1-2]。正是这种特殊结构赋 予β-Zn₄Sb₃异常的热电性能,因而其热导率极低^[3]。

基金项目: 宁波市国际科技合作资助项目(2007B10020); 宁波市自然科学基金资助项目(2006A610058)

收稿日期: 2007-06-22; 修订日期: 2007-09-13

通讯作者: 崔教林, 教授; 电话: 13968426800; E-mail: cuijl@nbip.net

TSUTSUI 等^[4]和 UENO 等^[5]分别报道热压烧结制备的 Zn-Sb 基块体的 ZT 值为 0.42 和大于 1, CAILLAT 等^[6]报道在 670 K 时其 ZT 值可达 1.3,远高于目前一 般的中温热电材料。

掺杂被认为是提高材料热电性能的有效手段之一,已在许多热电材料中得到证实^[7-8]。但对于 β-Zn₄Sb₃ 热电材料而言,通过掺杂来提高其性能的报 道并不多见,双元素共掺杂的报道更少。TSUTSUI 等^[4]和 NAKAMOTO 等^[9]、VIENNOIS 等^[10]曾分别采 用 In 和 Cd 元素掺杂 Zn₄Sb₃ 合金,研究得出 In 掺杂 可降低载流子浓度,提高材料的 Seebeck 系数,电导 率和热导率同时降低,适量的掺杂浓度可以提高综合 热电优值;掺杂 Cd 元素后形成的 Zn_{4-x}Cd_xSb₃ 合金具 有与β-Zn₄Sb₃材料不同的晶格常数,而且 Cd 掺杂增加 了载流子浓度和声子散射,材料的 Seebeck 系数和功 率因子都得到较大提升。

放电等离子烧结是一种新型的材料制备技术。该 技术利用脉冲电流、脉冲电压和焦耳热产生的瞬时高 温场来实现烧结过程,因而具有升温速度快、烧结时 间短、晶粒分布均匀等特点,有利于控制烧结体的细 微结构,获得高致密度和高性能的材料。在金属、陶 瓷、复合材料等诸多领域得到广泛应用^[11-14]。

本文作者拟采用 Cu 和 Bi 在 Zn-Sb 基合金中同时 掺杂。双元素掺杂有利于增加微结构的无序度,也可 增加无序结构对载流子和声子的散射,因而可提高材 料的 Seebeck 系数、降低晶格热导率。同时由于可能 生成的金属间化合物可以提高载流子浓度,增大材料 电导率。通过真空熔炼/球磨技术制备双元素共同掺杂 的 P 型 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 热电材料合金粉末,采用放电 等离子烧结(SPS)方法制备块体样品,并评价其热电性 能。

1 实验

按 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 的化学计量比(x=0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8)称量高纯度(>99.999%)的 Zn, Cu, Sb 和 Bi 单质,装入硬质石英管中真空密封,再放入电阻炉中 熔炼,熔炼时间和温度分别为 10 h 和 1 323 K,然后 经过淬火、粉碎获得 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金颗粒。颗粒 在 350 r/min 的速率下球磨 5 h 得到 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金粉末。粉末晾干后采用 SPS 烧结制得圆柱形样品 (*d* 20 mm×2.5 mm),烧结温度设定为 698 K。烧结后 在 453 K 下经过 10 h 退火以降低内应力。最后切割成 形,制得符合测试形状的样品(3 mm×2.5 mm×15 mm)。

块状样品的密度根据排水法测量。

利用 X 射线衍射分析仪测试 XRD 谱,以 Cu K_α 作为辐射源 (λ=0.154 06 nm),扫描速率为 4 (°)/min, 扫描范围为 10°~100°。在 He 环境中使用 ZEM-2 型 热电性能综合测试仪测试样品的电导率和 Seebeck 系 数。考虑到合金的熔点,测试温度范围选择为 313~583 K,每间隔 30 ℃测试一个数据。借助于在相同制备条 件下三元合金 Zn_{4-x}Cu_xSb₃ 的热扩散系数,计算获得材 料的无量纲热电优值(*ZT*)。

2 结果和讨论

2.1 Zn-Cu-Sb-Bi 合金的微结构分析

图 1 所示为不同 Cu 和 Bi 含量合金 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 粉末的 XRD 谱。从图 1 可以看出,当 *x*=0.1 时, Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金的衍射峰位置与β-Zn₄Sb₃ 相基 本对应,均具有相同的主要晶面(300),(113),(122), (104),(131),(223),(134),(143)和(151)。当 *x*>0.1 时,晶面(300),(104),(131),(223)和(134)等衍射峰 逐渐消失,出现 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x合金相结构。比较衍 射峰的强度发生,掺杂 Cu 和 Bi 以后,合金的衍射峰 强明显减弱,出现非晶组织的特征。对于热电材料来 说,晶粒越细,晶界对载流子和声子的散射作用越强, 导致电导率和热导率降低,因而材料的 Seebeck 系数 增大。



图 1 不同 Cu 和 Bi 含量 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x样品的 XRD 谱 Fig.1 XRD patterns of Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x powders with different Cu and Bi contents: (a) x=0; (b) x=0.1; (c) x=0.2; (d) x=0.4

当 *x*≥0.1 时, 谱图中还显示出少量 Bi 单质, 随着 *x* 值的增大, Bi 单质的峰逐渐增强。这说明部分 Bi 元素未能与其它元素形成固溶体, 而是以单质的形

式存在于合金体系中,Bi元素在合金中的溶解度极为 有限。Bi的电导率和热导率分别为 8.67×10⁵ S/m 和 7.87 W/(K·m)^[15],相对于β-Zn₄Sb₃而言,电导率和热 导率均较高,Bi单质的出现对材料热电性能会产生一 定的影响。

图 2 所示为合金密度与 Cu 和 Bi 含量的关系。在 原始配比中随着 Cu 和 Bi 含量的增高,材料的密度逐 渐从 6.09×10³ 增加到 6.84×10³ kg/m³,这是由于 Bi 的 密度远大于 Sb 的缘故。



图 2 不同 Cu、Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 样品密度 Fig.2 Dependence of densities on Cu and Bi contents in samples

2.2 Cu 和 Bi 含量对合金电学性能的影响

图 3 所示为 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金的电导率(σ)与温度的关系。掺杂合金的电导率随温度逐渐上升,也随合金中 Cu、Bi 的含量而增高。其原因可能是由于合金的电导率由载流子浓度和迁移率共同决定。合金中 Cu 和 Bi 含量增大后,杂质能带的引入使禁带变窄,载流子浓度因而增大;单质 Bi 的析出也可导致材料电导率上升。但掺杂后材料为多晶材料,来自点、线等晶格缺陷会对载流子的迁移率产生较大影响,电导率会因此降低。虽然金属 Bi 元素的析出可以增加部分电导率,但所产生的点缺陷和线缺陷可以大大降低材料的迁移率。所以当 $x \leq 0.4$ 时掺杂合金的电导率均低于未掺杂的 β -Zn₄Sb₃ 材料的电导率, x > 0.8 合金具有较高电导率的原因可能是由于较高的 Bi 含量所致。

图 4 所示为不同 Cu 和 Bi 含量的合金 Seebeck 系数(α)与温度的关系。由图 4 可见,适量的 Cu 和 Bi 含量对提高材料的 Seebeck 系数极为有利。随 Cu 和 Bi 含量的增加,材料的 Seebeck 系数增加,当 x=0.2, 487 K 时 α 值达到最大值 249.2 μ V/K,然后随 Cu 和 Bi 含量的增加而下降。除摩尔分数 x=0.8 的合金外, 掺杂合金的 Seebeck 系数明显高于未掺杂的 β -Zn₄Sb₃



图 3 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金电导率与温度的关系

Fig.3 Relationships between electrical conductivities and temperature for $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ samples prepared by spark plasma sintering



图 4 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金 Seebeck 系数与温度的关系

Fig.4 Relationships between Seebeck coefficients and temperature for $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ samples prepared by spark plasma sintering

材料。掺杂 Cu 和 Bi 后 α 上升也不能简单地只根据载 流子浓度的变化加以解释,必须考虑掺杂后载流子受 到的散射等因素。当空穴浓度按照 Boltzmann 分布时, 在给定温度下 Seebeck 系数(α)和散射因子之间的关 系可以表示为^[16]

$$\alpha = \frac{\kappa_{\rm B}}{e} \left[S + \frac{5}{2} + \ln \frac{2(2\pi \, m^* \kappa_{\rm B} T)^{3/2}}{nh^3} \right] \tag{1}$$

式中 K_B为玻尔滋曼常数; e 为电子电荷; m^{*}为有效 质量; n 为载流子浓度; h 为 Planck 常数; S 为散射因 子。因为掺杂 Cu 和 Bi 后,不论是产生固溶还是生成 金属间化合物均可使合金中晶界面积增大,晶格畸变 加重,提高散射因子 S,从而提高 Seebeck 系数。根 据前期对 β -Zn₄Sb₃中掺 Cu 的合金输运性能研究表明, 在多相结构的 Zn-Sb 基合金中,元素在各相中的分布 是极不均匀的。在本次工作中,烧结以后所产生的 Zn 挥发以及掺杂原子 Cu 和 Bi 在子晶格中的可能间隙插 入,均可以产生晶格畸变,对载流子产生散射,从而 引起 α 上升。掺杂量较低时($x \le 0.2$),材料内部载流子 受到的晶界和点缺陷散射作用较大,而空穴浓度相对 较低,因此 α 值随摩尔分数增大;而当 x > 0.2 以后, 空穴浓度的增加抵消了散射因子对 Seebeck 系数的影 响,Seebeck 系数开始下降,所以 Seebeck 系数随 Cu, Bi 含量的继续增高而下降。

2.3 Cu 和 Bi 含量对合金热学性能的影响

合金的热导率(k)由晶格热导率(k_L)和载流子热导率(k_e)共同组成,即:

 $k = k_{\rm L} + k_{\rm e}$

式中 k_e 为根据 Wiedemanmm—Franz 定律由实测的 电导率计算; L 为 Lorenz 常数,取 $L=1.5\times10^{-8}$ W· $\Omega/K^{2[17]}$ 。在材料制备工艺和主要成分基本相同的情 况下, $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ 合金的热扩散系数值可以引 用 $Zn_{4-x}Cu_xSb_3$ 合金的实测值,计算获得总热导率值 (k),结果如图 5 所示。 $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ 合金的热导率 都高于 β - Zn_4Sb_3 ,并且随着 Cu 和 Bi 含量的增加而升 高,在整个温区内各合金的热导率与温度的变化较 小。说明添加 Cu 和 Bi 两元素后,材料呈现出非晶特 征,这与 X 射线衍射获得的结果相一致。当 x=0.4 时, 总热导率在 1.6 W/(m·K)左右。

图 6 所示为载流子热导率(ke)与温度的关系。根据



图 5 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x样品热导率与 温度的关系

Fig.5 Relationship between thermal conductivities and temperature for $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ samples prepared by spark plasma sintering

Wiedemanmn—Franz 定律 k_e = $LT\sigma$, k_e 与合金的电导率 呈正比,因此 k_e 与温度的关系呈现出与 σ —T相同的 变化趋势。晶格热导率(k_L)与温度的关系如图 7 所示, k_L 值随温度缓慢下降,但随着 Cu 和 Bi 元素的含量增 加而提高,这可能与合金中金属未固溶的 Bi 含量增加 有关。



图 6 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 样品载流子热 导率与温度的关系

Fig.6 Relationships between lattice thermal conductivities and temperature for $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ samples prepared by spark plasma sintering



图 7 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x样品晶格热导 率与温度的关系

Fig.7 Relationships between electronic thermal conductivities and temperature for $Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x$ samples prepared by spark plasma sintering

材料的热电优值(*ZT*)与温度的关系如图 8 所示, *ZT* 值随温度上升。当 $x \ge 0.2$ 时, Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金 的 *ZT* 值逐渐大于未掺杂合金,当 x=0.4 时、温度为 574 K 时热电优值获得了最大值 0.53,而同温度下 β-Zn₄Sb₃ 合金的最大 *ZT* 值为 0.46。说明掺杂适量的 Cu 和 Bi 元素可改善材料的热电性能。



图 8 不同 Cu 和 Bi 含量的 Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 样品热电优值 *ZT* 与温度的变化关系



3 结论

 i) 掺杂 Cu 和 Bi 后, Zn_{4-x}Cu_xSb_{3-x}Bi_x 合金的电导 率随 Cu 和 Bi 含量而增加。当 x≤0.4 时,掺杂合金的 电导率均低于未掺杂合金。

 掺杂 Cu 和 Bi 后材料的 Seebeck 系数上升,当 x=0.2 时, α 值达到最大值为 249.2 μV/K, 然后随 Cu 和 Bi 含量增加又下降。

3) 掺杂了 Cu 和 Bi 以后材料热导率与温度的变 化关系不大,呈现出非晶特征。但随着掺杂量的增加, 热导率增加。

4) 通过掺杂 Cu 和 Bi 两元素,材料的热电性能得 到了优化,组成为 Zn_{3.6}Cu_{0.4}Sb_{2.6}Bi_{0.4}的合金热电优值 最大,在 574 K 时其 ZT 值为 0.53,比同温度下β-Zn₄Sb₃ 合金的 ZT 值大 0.07。

REFERENCES

- MAYER H W, MIKHAIL I, SCHUBERT K. Über einige phasen der Mischungen ZnSb_N und CdSb_N[J]. J Less Comm Metals, 1978, 59(1): 43–52.
- [2] NYLĖN J, ANDERSSON M, LIDIN S, HÄUSSERMANN U. The structure of α-Zn₄Sb₃: Ordering of phonon-glass thermoelectric material β-Zn₄Sb₃[J]. J Am Chem Soc, 2004, 126(50): 16306–16307.
- [3] SNYDER G J, CHRISTENSEN M, NISHIBORI E. Disordered zinc in Zn₄Sb₃ with phonon glass, electron crystal thermoelectric properties[J]. Nature Mater, 2004, 3: 458–463.
- [4] TSUTSUI M, ZHANG L T, ITO K, YAMAGUCHI M. Effects of in-doping on the thermoelectric properties of β-Zn₄Sb₃[J]. Intermetallics, 2004, 12(7/9): 809–813.

- [5] UENO K, YAMAMOTO A, NOGUCHI T, INOUE T, SODEOKA S, TAKAZAWA H, LEE C H, OBARA H J. Optimization of hot-press conditions of Zn₄Sb₃ for high thermoelectric performance: I . Physical properties and thermoelectric performance[J]. J Alloys and Compd, 2004, 384(1/2) 254–260.
- [6] CAILLAT T, FLEURIAL J P, BORSHCHEVSKY A. Preparation and thermoelectric properties of semiconducting Zn₄Sb₃[J]. J Phys Chem Solids, 1997, 58(7): 1119–1125.
- [7] CUI J L, XUE H F, XIU W J, JIANG L, YING P Z. Thermoelectric properties of p-type pseudo-binary (Ag_{0.365}Sb_{0.558}Te)_x- (Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te₃)_{1-x} (x=0-1.0) alloys prepared by spark plasma sintering[J]. J Solid State Chem, 2006, 179(12): 3751-3755.
- [8] HE Ze-ming, PLATZEK D, STIEWE C, CHEN H, KARPINSKI G, MÜLLER E. Thermoelectric properties of hot-pressed Al- and Co-doped iron disilicide materials[J]. J Alloys and Compd, 2007, 438(1/2): 303–309.
- [9] NAKAMOTO G, SOUMA T, YAMABA M, KURISU M. Thermoelectric properties of (Zn_{1-x}Cd_x)₄Sb₃ below room temperature[J]. J Alloys and Compd, 2004, 377(1/2): 59–65.
- [10] VIENNOIS R, RECORD M C, IZARD V. Raman scattering study of the lattice dynamics of β-Zn_{4-x}Cd_xSb₃[J]. J Alloys and Compd, 2007, 440(1/2): 22–25.
- [11] GUO Zhi-quan, Gurdial Blugan, René Kirchner, Mike Reece, Thomas Graule, Jakob Kuebler. Microstructure and electrical properties of Si₃N₄-TiN composites sintered by hot pressing and spark plasma sintering[J]. Ceramics Inter, 2007, 33(7): 1223–1229.
- [12] JIANG Dong-tao, Hulbert D M, Kuntz J D, Umberto Anselmi-Tamburini, Mukherjee A K. Spark plasma sintering: A high strain rate low temperature forming tool for ceramics[J]. Mater Sci Eng A, 2007, 463(1/2): 89–93.
- [13] SASAKI T T, MUKAI T, HONO K. A high-strength bulk nanocrystalline Al-Fe alloy processed by mechanical alloying and spark plasma sintering[J]. Scripta Mater, 2007, 57(3): 189–192.
- [14] KUBOTA M. Properties of nano-structured pure Al produced by mechanical grinding and spark plasma sintering[J]. J Alloys Comp, 2007, 434/435: 294–297.
- [15] 李梦龙. 化学数据速查手册[M]. 第一版. 北京: 化学工业出版社, 2003: 17.
 LI Meng-long. Concise handbook of chemical data[M]. 1st ed. Beijing: Chemical Engineering Press, 2003: 17.
- [16] KIM S S, YAMAMOTO S, AIZAWA T. Thermoelectric properties of anisotropy-controlled p-type Bi-Te-Sb system via bulk mechanical alloying and shear extrusion[J]. J Alloys Comp, 2004, 375(1/2): 107–113.
- [17] VENKATASUBRAMANIAN R, SIIVOLA E. Thin film thermoelectric devices with high room-temperature figures of merit[J]. Nature, 2001, 413: 597–602.

107

(编辑 龙怀中)